

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成28年9月29日(2016.9.29)

【公表番号】特表2015-533415(P2015-533415A)

【公表日】平成27年11月24日(2015.11.24)

【年通号数】公開・登録公報2015-073

【出願番号】特願2015-538045(P2015-538045)

【国際特許分類】

G 0 1 N	23/205	(2006.01)
G 2 1 K	1/02	(2006.01)
G 2 1 K	3/00	(2006.01)
G 2 1 K	1/00	(2006.01)
G 0 1 T	1/20	(2006.01)
G 0 1 T	7/00	(2006.01)

【F I】

G 0 1 N	23/205	3 1 0
G 2 1 K	1/02	C
G 2 1 K	3/00	S
G 2 1 K	1/00	X
G 0 1 T	1/20	C
G 0 1 T	7/00	B

【手続補正書】

【提出日】平成28年8月4日(2016.8.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0030

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0030】

図2Aは広帯域の分散ビームが試料の結晶粒によって回折されるときの相対距離を示す側面図である。具体的には、光源110と試料10の間の距離はd<sub>ss</sub>である。試料10とラウ工焦点面50の間の距離はd<sub>s</sub>d<sub>1</sub>であり、試料10と投影面52の間の距離はd<sub>s</sub>d<sub>2</sub>である。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0039

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0039】

3次元結晶粒マップの再構成のために試料面に結晶粒の輪郭を再度投影する1つの手法は、投影面からラウ工焦点面50におけるライン焦点を通して結晶粒形状を再投影することである。そうすると、試料内の正確な結晶粒位置に関する推論とともにセットアップ(光源位置)の幾何学的形状がわかっているので、反射を生じさせる屈折率および波長を識別することができる。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0078

【補正方法】変更

**【補正の内容】****【0078】**

場合によっては、コントローラ105はラウエ検出器150からのデータのみまたは投影面検出器152からのデータのみを使用して試料10を分析する。しかしながら、一般的にはラウエ検出器150から得た情報が試料の分析に最も役立つ。